

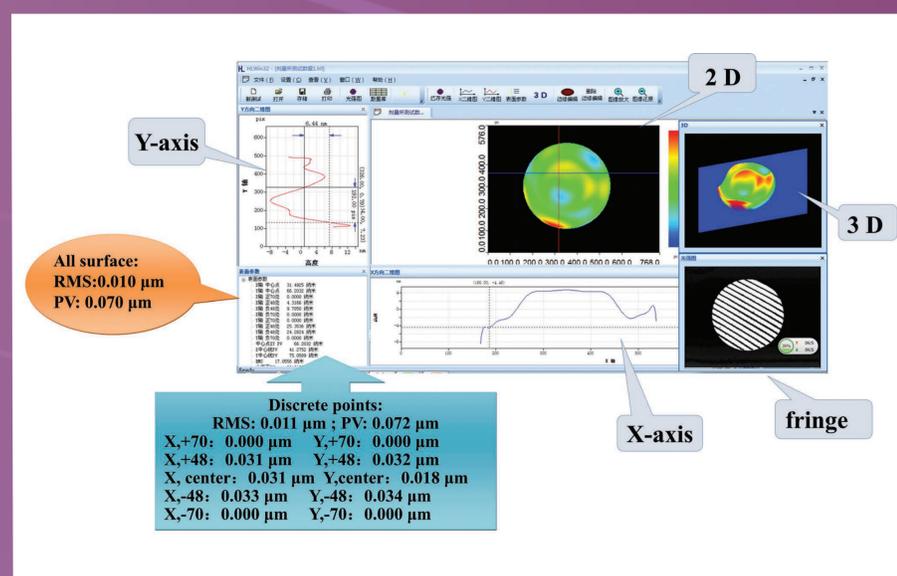


# Ultrahigh Precision Optical Flatness Tester

## Testeur de Précision Ultra-Haute pour la Planéité Optique

### Introduction

Optical flatness can be achieved through discrete points collected by this high precision non-contact optical flat verification instrument, which conforms to the current quantity traceability system in China. The measured results can be used to compare with the thickness interferometry data collected by other institutions. The entire optical flat surface information can be obtained while the real-time three-dimensional topography is displayed. This follows the development of modern flatness measurement trends.



### Special Features and Advantages

- Non-contact
- High precision
- High efficiency
- Combined design
- Real-time interferometric imaging technology
- Both domestic (Chinese) and international convention verification

### Applications

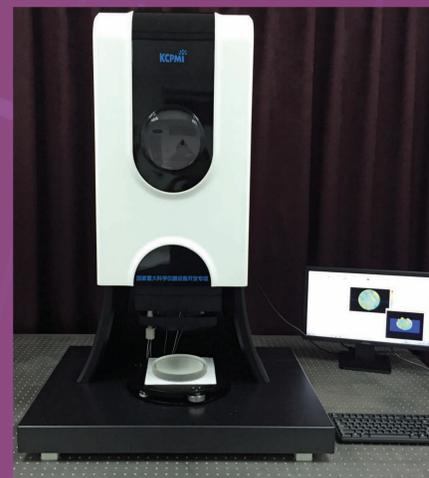
- Metrology
- Optical measurement
- Microelectromechanical system (MEMS)

### Awards

Innovative Product Award of Chinese Society for Optical Engineering, China (2015)

### Introduction

Cet instrument de haute précision pour la vérification de non contact de la planéité optique est en conformité avec le système actuel de traçabilité de quantité en Chine et peut glaner des points discrets qui aident à réaliser la planéité optique. Les résultats mesurés peuvent être utilisés pour la comparaison avec les données d'interférométrie sur l'épaisseur recueillies par autres institutions. L'intégralité des informations sur la surface plate optique peut être obtenue tandis que la topographie tridimensionnelle est affichée en temps réel. Cette invention suit le développement des tendances modernes de mesure de planéité.



Aperture Size	6"(and 4")
Wavelength	632.8 nm
Reference Surface	$\lambda/20$
Absolute Flatness PV	$\lambda/100$
Precision	$\lambda/600$
Repeatability PV	$\lambda/500$
Repeatability (RMS)	$\lambda/1000$
Model	HOOL L9600A (L9400A)
Dimension	798×598×1078mm
Power	220V 50Hz (110V 60Hz)

### Caractéristiques Particulières et Avantages

- Non contact
- Haute précision
- Haute efficacité
- Conception mixte
- Technologie d'imagerie interférométrique en temps réel
- Vérification de convention à la fois domestique (Chine) et internationale

### Applications

- Métrologie
- Mesure optique
- Système microélectromécanique (SMEM)

### Principal Investigators

Prof. Sen HAN  
 School of Optical-Electrical and Computer Engineering  
 University of Shanghai for Science and Technology (China)  
 Suzhou H&L Instruments LLC, China  
 Email: senhanemail@126.com